(2)

По формуле (2) ручная сборка (Q \approx 300 комп/час) целесообразна при объеме выпуска N \approx 300/0,062 = 4800 изделий/год; полуавтоматы (Q \approx 700 комп/час) целесообразны при N = 11000 изделий/год. При более высоких значениях N целесообразно применять автоматы-установщики той или иной производительности.

Список использованных источников

создания современного высокотехнологичного сборочного производства печатных узлов/ЗАО «Предприятие ОСТЕК», M., 2006.

2. Медведев А. М. Сборка и монтаж электронных устройств [Текст]/ А.М. Медведев – М.: Техносфера, 2007. – 256 с.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ НАДЁЖНОСТИ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ МИКРОСХЕМ

В. С. Бозриков

Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королёва (национальный исследовательский университет),

г. Самара

(МПФ) наиболее функций широко Метод потенциальных практике индивидуального прогнозирования (ИП) применяется классификацией на основе теории распознавания образов. Постановка задачи прогнозирования в МПФ сводится к нахождению оператора прогнозирования потенциальной функции.

Предлагается осуществить нормирование следующим образом:

 $x_{iH}^{(j)} = x_i^{(j)}/D^{*1/2}[X_i],$ где $x_{iH}^{(j)}$ - нормированное значение i-го признака j-го экземпляра; $x_i^{(j)}$ - измеренное значение i-го признака j-го экземпляра; $D^{*1/2}[X_i]$ - оценка дисперсии i-го признака по всем экземплярам.

Переходя от значений признаков $\hat{\mathbf{k}}$ их разностям, находят $R_i^{(j,l)}$

единичное расстояние между значениями i-го признака для j-го и 1-го экземпляров. $R_i^{(j)} = |x_i^{(j)} - x_i^{(l)}|$.

Введем понятие потенциала j-го экземпляра, наводимого на него l-м экземпляром:

 $\varphi^{(j1)} = Q1/(1 - \alpha [R_i^{(j1)}]^{\beta}),$

где α и β коэффициенты, определяемые экспериментально (часто берут $\alpha=4$ и $\beta=3$); $Q=\pm 1$ - коэффициент, учитывающий класс $(K_1$ и K_2), к которому принадлежит l-й экземпляр.

Пусть по результатам обучающего эксперимента оказалось, что число экземпляров, принадлежащих к классу K_l равно n_l , а число экземпляров класса K_2 - n_2 ; n_l + n_2 = n. Располагая значениями всех $\varphi^{(l)}(j,l=1,2,...,n;\ j\neq l)$, можно вычислить суммарный потенциал каждого экземпляра, используемого в обучающем эксперименте. Тогда для любого j-го экземпляра, принадлежащего к классу K_l этот суммарный потенциал находится по формуле

$$\varphi_{j\in\mathcal{K}1,\Sigma} = \frac{1}{n_1-1} \sum_{\substack{l \in \mathcal{K}2 \\ l \neq j}} \varphi^{jl} + \frac{1}{n_2} \sum_{\substack{l \in \mathcal{K}2 \\ }} \varphi^{jl}.$$

Пусть $\Pi_{\varphi}=0$. Тогда, если $\varphi_{j\approx KI_1\Sigma}\geq 0$, тоj-й экземпляр относим к классу K_1 если $\varphi_{j\approx KI_1\Sigma}<0$, то j-й экземпляр относим к классу K_2 , Число ошибочных решений обозначим $n(K_1/pew.K_2)$.

Аналогично для каждого j-го экземпляра класса K_2 найдем суммарный потенциал:

$$\varphi_{j\in K2,\Sigma} = \frac{1}{n_1} \sum_{l\in K1} \varphi^{jl} + \frac{1}{n_2-1} \sum_{\substack{l\in K2\\l\neq j}} \varphi^{jl}.$$

Если $\varphi_{i \approx K2, \Sigma} < 0$, то *j*-й экземпляр принадлежит к классу K_2 ; если $\varphi_i \approx K2, \Sigma \ge 0$ - принимаем решение об отнесении *j*-го экземпляра к классу K_i .

Число ошибочных решений обозначим $n(K_2/pew.K_l)$. Если оценки вероятностей ошибочных решений согласуются с установленными требованиями, считаем, что экзамен прошел успешно и полученным оператором можно пользоваться для прогнозирования класса изделий этого вида.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ НАДЁЖНОСТИ ЦИФРОВЫХ МИКРОСХЕМ

Д. Н. Виноградов

Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королёва (национальный исследовательский университет), г. Самара